



MATERIA

**INSTITUTO DE MICRO Y
NANOTECNOLOGÍA (IMN-CNM)**



SEM DE ULTRA ALTA RESOLUCIÓN

SEM FEI Verios 460. Resolución: 0,6 nm at 2 kV; 0,7 nm at 1 kV. Adquisición simultánea de hasta 4 imágenes con contraste morfológico y/o contraste en composición. Resolución extrema en muestras aislantes, muestras frágiles o muestras biológicas con energías de haz hasta 20 eV, sin necesidad de recubrimientos y con sustratos de vidrio o de plástico.

Análisis cuantitativo de elementos por Espectroscopia de RX por Dispersión de Energía (EDX).

<http://www.imn.cnm.csic.es/es/servicios>